

JIS

電磁両立性－第 4-6 部：試験及び測定技術－ 無線周波電磁界によって誘導する 伝導妨害に対するイミュニティ

JIS C 61000-4-6 : 2026

(IEC 61000-4-6 : 2023)

(JSA)

令和 8 年 2 月 20 日 改正

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

一般財団法人日本規格協会 電気分野産業標準作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	馬場 旬平	東京大学
(委員)	加藤 有利子	一般財団法人電気安全環境研究所
	香月 嘉史	一般社団法人送配電網協議会
	鈴木 義夫	一般社団法人電気設備学会
	辻 勝也	一般社団法人日本電気計測器工業会
	西原 敏之	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	南 裕二	東芝エネルギーシステムズ株式会社
	本吉 高行	一般社団法人電気学会
	山野 芳昭	千葉大学名誉教授
	若月 壽子	主婦連合会
	綿貫 宏樹	一般社団法人日本電機工業会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 11.2.20 改正：令和 8.2.20

担 当 部 署：経済産業省イノベーション・環境局 国際電気標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 8.2.20

認定産業標準作成機関：一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-11-28 三田 Avanti)

素 案 作 成 者：一般社団法人電気学会

(〒102-0076 東京都千代田区五番町 6-2 HOMAT HORIZON ビル)

審 議 委 員 会：電気分野産業標準作成委員会 (委員長 馬場 旬平)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関又は素案作成者にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

目次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	2
3 用語及び定義	2
4 一般	4
5 試験レベル	6
6 試験装置及びレベル調整手順	7
6.1 試験信号発生器	7
6.2 結合デバイス及び減結合デバイス	8
6.3 結合デバイス及び減結合デバイスの EUT ポートでのコモンインピーダンスの検証	16
6.4 試験信号発生器の設定	18
7 試験セットアップ及び注入方法	21
7.1 試験セットアップ	21
7.2 単一のユニットからなる EUT	22
7.3 幾つかのユニットからなる EUT	24
7.4 注入方法及び試験ポイントの選択	25
7.5 CDN 注入	27
7.6 クランプ注入	28
7.7 直接注入	31
8 試験手順	31
9 試験結果の評価	32
10 試験報告書	33
附属書 A (規定) EM クランプ及び減結合クランプ	34
附属書 B (参考) 試験周波数範囲の選択基準	45
附属書 C (参考) 試験レベルを選択するための指針	47
附属書 D (参考) 結合・減結合回路網 (CDN) に関する情報	48
附属書 E (参考) 試験信号発生器の仕様に関する情報	54
附属書 F (参考) 大型 EUT の試験セットアップ	55
附属書 G (参考) 試験レベル (電圧) の測定不確かさ	58
附属書 H (参考) 複数の信号による試験	70
附属書 I (参考) ポート間注入	73
附属書 J (参考) 電力増幅器の圧縮及びノンリニアリティ	75
参考文献	80
解説	81

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般財団法人日本規格協会 (JSA) から、産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS C 61000-4-6:2017** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

電磁両立性—第 4-6 部：試験及び測定技術— 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対する イミュニティ

Electromagnetic compatibility (EMC)—Part 4-6: Testing and measurement techniques—Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

序文

この規格は、2023 年に第 5 版として発行された IEC 61000-4-6 を基に、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格である。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は、対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲

この規格は、周波数範囲 150 kHz～80 MHz の意図的な無線周波 (RF) 送信機から到来する電磁妨害に対する電気・電子装置の伝導性イミュニティ要求事項について規定する。

注記 1 この規格で規定する方法及び試験機器は、80 MHz までの周波数範囲の使用を意図しているが、この規格を引用する規格を作成する製品規格原案作成委員会は、この方法を 230 MHz までの周波数において用いることを決定する可能性がある (附属書 B 参照)。

ただし、妨害 RF 電磁界を結合させる導線又はケーブル (例えば、電源線、信号線又はグラウンド線) を一つもたない装置は、この規格の適用範囲から除外する。

注記 2 電磁放射によって誘導する伝導妨害信号が、関連装置に及ぼす影響を評価する試験方法を、この規格の中で定めている。これらの伝導妨害のシミュレーション及び測定は、影響の定量的な決定のためには適切で正確なものとはいえない。影響の定量的分析のために、各種の設備での結果の適切な再現性を確立することを主要な目的として、この規格を構成している。

この規格の目的は、RF 電磁界によって誘起する伝導妨害に対して、電気・電子装置の機能的イミュニティを評価するための共通基準を確立することである。この規格は、規定した現象に対する、装置又はシステムのイミュニティを評価するための方法を規定している。

注記 3 この規格は、IEC Guide 107 で記載しているように、製品規格を作成するときに用いる基本 EMC 規格である。また、製品規格原案作成委員会は、このイミュニティ試験規格を適用するかどうかを決定する責任をもつ。さらに、適用する場合、適切な試験レベル及び性能評価基準を決める責任がある。

注記 4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。